

DIN EN ISO 3543:2001-12 (D)

Metallische und nichtmetallische Schichten - Dickenmessung - Betarückstreu-Verfahren (ISO 3543:2000); Deutsche Fassung EN ISO 3543:2000

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Begriffe	3
3 Prinzip	6
4 Messeinrichtungen	6
5 Faktoren, die die Messunsicherheit beeinflussen	6
5.1 Zählstatistik	6
5.2 Schicht- und Grundwerkstoff	8
5.3 Blende	8
5.4 Schichtdicke	8
5.5 Auflösungszeit des Detektors	8
5.6 Strahlergeometrie	8
5.7 Krümmung	9
5.8 Dicke des Grundwerkstoffs	9
5.8.1 Messgegenstände ohne Zwischen- 0.0.0 schichten zwischen Schicht- und 0.0.0 Grundwerkstoff	9
5.8.2 Messgegenstände mit Zwischen- 0.0.0 schichten zwischen Schicht- und 0.0.0 Grundwerkstoff	9
5.9 Oberflächenreinheit	9
5.10 Grundwerkstoff	9
5.11 Dichte des Schichtwerkstoffs	10
5.12 Zusammensetzung des 0.00 Schichtwerkstoffs	10
5.13 Energie der Betateilchen	10
5.14 Messzeit	10
5.15 Aktivität der radioaktiven Quelle	10
5.16 Kombination Schicht-/Grundwerkstoff 10 5.17 Oberflächenrauheit	10
6 Kalibrierung der Geräte	10
6.1 Häufigkeit der Kalibrierung	10
6.2 Kalibrierverfahren	10
6.3 Referenzproben	11
6.4 Dicke des Grundwerkstoffs	11
6.5 Krümmung	11
7 Durchführung der Messung	11
7.1 Kalibrierung und Bedienung	11
7.2 Vorsichtsmaßnahmen	11
8 Messunsicherheit	12
9 Prüfbericht	12